

## PATDPA

PATDPA ファイルは、ドイツ特許商標庁 (Deutsches Patent- und Markenamt) によって発行された、すべての種類の特許資料および実用新案の書誌事項と法的状況を収録しています。また、この中にはヨーロッパ特許庁 (European Patent Office) および世界知的所有権機構 (World Intellectual Property Organization: WIPO) への出願で、指定国がドイツ連邦共和国であるものが含まれています。

ドイツ特許の資料には、1981 年以降現在までの抄録、1992 年 6 月以降のヨーロッパ登録特許の主クレームのドイツ語訳、および 1996 年 1 月以降の全ドイツ登録特許の主クレームを収録しています。ヨーロッパ特許資料は 1998 年 8 月以降のドイツ語による出願の抄録、および 1998 年 8 月以降の全ヨーロッパ登録特許の主クレームを収録しています。WIPO 特許資料は、1998 年 8 月以降ドイツ語による出願の抄録を収録しています。また、最初の公開のフロント ページに収められている特許図面、化学構造式、および複雑な数式を、1983 年以降画像情報として収録しています。さらに、サーチレポートの特許および非特許文献の先行技術引用文献を収録しています。

このデータベースの言語はドイツ語です。

このデータベースは STN Easy で利用できます。

<https://stneasy-japan.cas.org>

## 収録内容

全特許に関連した分野、すなわち国際特許分類の全クラス

## 収録源

ドイツ特許刊行物 Offenlegungsschrift (公開公報),  
Auslegeschrift (公告公報), Patentschrift (特許公報)  
(1968 年～2011 年 6 月)

ドイツ実用新案刊行物 (1968 年～2011 年 6 月)  
ドイツを指定国とする EP および PCT 出願  
(1978 年～2011 年 6 月)

## ファイル内容

1968 年から 2011 年 6 月まで  
画像データについては 1983 年から 2011 年 6 月まで  
7,872,000 件以上 (2011 年 7 月現在)  
760,000 以上の画像データ (2011 年 7 月現在)

更新停止  
アラート (自動 SDI 検索) は実行されません

## 検索補助資料

PATDPA データベースデスクリプション (ドイツ語)  
STNGUIDE

オンラインヘルプ (HELP DIRECTORY で利用できる  
すべてのヘルプメッセージが表示されます)

## データベース製作者

Deutsches Patent- und Markenamt  
German Patent and Trademark Office  
Zweibrueckenstrasse 12  
D-80331 Muenchen  
Germany  
Phone: (+49)89 2195 0  
Fax: (+49)89 2195 22 21  
E-mail: [patentamt@deutsches-patentamt.de](mailto:patentamt@deutsches-patentamt.de)  
著作権所有者

## データベース提供者

FIZ Karlsruhe  
P. O. Box 2465  
D-76012 Karlsruhe  
Germany  
STNmail: HLPDESKK  
Phone: (+49)7247/808-555  
Fax: (+49)7247/808-259  
E-mail: [helpdesk@fiz-karlsruhe.de](mailto:helpdesk@fiz-karlsruhe.de)

## ヨーロッパ

## STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe  
P.O. Box 2465  
76012 Karlsruhe  
Germany  
Phone: +49-7247-808-555  
Fax: +49-7247-808-259  
E-mail: [helpdesk@fiz-karlsruhe.de](mailto:helpdesk@fiz-karlsruhe.de)  
Internet: [www.stn-international.de](http://www.stn-international.de)

## 日本

## STN 東京

一般社団法人 化学情報協会  
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル  
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)  
: 0120-151-462 (上記以外)  
Fax: 03-5978-4090  
E-mail: [support@jaici.or.jp](mailto:support@jaici.or.jp) (Help Desk)  
[customer@jaici.or.jp](mailto:customer@jaici.or.jp) (上記以外)  
Internet: [www.jaici.or.jp](http://www.jaici.or.jp)

## 北アメリカ

## STN コロンバス

CAS  
P.O. Box 3012  
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A  
CAS Customer Care:  
Phone: 800-753-4227 (North America)  
614-447-3700 (worldwide)  
Fax: 614-447-3751  
E-mail: [help@cas.org](mailto:help@cas.org)  
Internet: [www.cas.org](http://www.cas.org)

## SEARCHおよびDISPLAYフィールド

後方一致検索可能なフィールド (/BI) はアスタリスク (\*)で示してあります。

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
ベーシックインデックス * 1) 発明の標題 (/TI) 抄録 (/AB) 主クレーム (/MCLM) (以上からの切出し語)	なし または/BI	S KUEHLUNG (S) ACHSE? S PLAN? POSITION? S BETRIEB	AB, MCLM, TI
レコード番号	/AN	S DE69700021/AN	AN
代理人	/AG	S ZAHN ROLAND/AG	AG
代理人番号	/AGN	S 120626/AGN	AGN
出願国	/AC	S EP/AC	AI
出願日 2)	/AD	S 19950108/AD	AI
出願種類コード	/AK	S DEA/AK	AI
出願番号 3)	/AP	S DE81-3152498/AP S 81DE-3152498/AP	AI
出願タイプ	/AT	S ADP/AT	AI
出願年 2)	/AY	S 1998/AY	AI
分類コード 4) (コードおよび分類項目名)	/CC	S UMWELTSCHUTZ/CC S 02/CC S (ENERGIESPARENDE (W) TECHNIK) /CC	CC
データ入力日 2)	/DED	S DED>NOV 1998	DED
データ入力週 2)	/DEW	S 199829/DEW	DEW
データ更新日 2)	/DUP	S 3 DEC 1998/DUP	DUP
指定国	/DS	S W DE/DS	DS
指定国グループ	/DS. F	S GB/DS. F	FIP
資料タイプ (コードおよび説明句)	/DT	S U/DT	DT
入力日 2)	/ED	S 19981015/ED	ED
抄録または主クレーム入力日 2)	/EDAB	S EDAB>=DEC 1998	EDAB
対応特許出願国	/FAC	S WO/FAC	FIA
対応特許出願日 2)	/FAD	S 18 Nov 1998/FAD	FIA
対応特許種類コード	/FAK	S EPAW/FAK	FIA
対応特許出願番号 3)	/FAP	S DE98-19800050/FAP S 98DE-19800050/FAP	FIA
対応特許出願タイプ	/FAT	S ADU/FAT	FIA
対応特許出願年 2)	/FAY	S 1998/FAY	FIA
対応特許国	/FC	S DE/FC	FIP
対応特許種類コード	/FK	S DEA1/FK	FIP
対応特許番号 3)	/FN	S DE3152498/FN	FIP
対応特許発行日 2)	/FD	S 19920101-19920331/FD	FIP
対応特許発行タイプ	/FPT	S UGO/FPT	FIP
対応特許年 2)	/FY	S 1993/FY	FIP
フィールドの存在	/FA	S KUEHLUNG AND AB/FA	FA
国際特許分類 (IPC) (主分類および副分類を含む)	/IC	S B60B007-02/IC S B60B007/IC	IC
発明者 (現行および旧形式)	/IN	S SCHULTE/IN S HAUSKE, JAMES/IN S WALLACE H?/IN	IN
発明者住所 (現行形式)	/INA	S BERLIN/INA	IN
発明者 (現行形式)	/INC	S AHL, T?/INC	IN
発明者 (旧形式)	/INO	S HAAG, F?/INO	INO

(続く)

- 1) 前方一致、後方一致および中間任意検索がこのフィールドで利用可能です。利用の際には、語幹の長さは4文字以上必要です。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) STN形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

## SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
IPC、追加分類 (参考情報)	/ICA	S F01L001-04/ICA	ICA
IPC、索引分類 (相補情報)	/ICI	S C07D205:08/ICI	ICI
IPC、主分類 (現行IPC第6版の主分類、 以前の版に対する対応あり)	/ICM	S B21B001-00/ICM	ICM
IPC、メイングループ、範囲検索 <sup>2)</sup>	/MGR	S H01R/ICM (L) 15-23/MGR	ICM
IPC、主分類、旧版	/ICMO	S B60B011-02/ICMO	ICMO
IPC、副分類 (現行)	/ICS	S C01B003-12/ICS	ICS
IPC、副分類 (旧版) (対応あり)	/ICSO	S H01J023-36/ICSO	ICSO
IPC、サブグループ、範囲検索 <sup>2)</sup>	/SGR	S B60B007/ICS (L) 2100>SGR	ICS
言語 (コード および言語名)	/LA	S EN/LA	LA
法的状況	/NTL	S AOR/NTL	NTL
法的状況日付 <sup>2)</sup>	/NTDL	S 19990118/NTDL	NTL
自国 (ドイツ) 特許分類	/NCL	S 12D 1-03/NCL	NCL
法的状況 (コード)	/NTE	S ADR/NTE	NTE
法的状況日付 <sup>2)</sup>	/NTD	S 19931231/NTD	NTE
異議申立人 <sup>4)</sup>	/OP	S DAIMLER BENZ/OP	OP
その他の収録源	/OS	S “ 101:130507” /OS	OS
Passat ターム	/PST	S TRANSISTOR/PST	PST
特許権利人/出願人 <sup>4)</sup>	/PA	S FAMAG/PA	PA, PAO
(現行形式および旧形式)	または/CS		
特許権利人/出願人住所 <sup>4)</sup>	/PAA	S KARLSRUHE/PAA	PA, PAA, PAO
(現行形式)			
特許権利人/出願人 <sup>4)</sup> (現行形式)	/PAC	S GIAMPAOLO/PAC	PA
特許権利人/出願人番号	/PAN	S 0100020/PAN	PAN
特許権利人/出願人番号 <sup>4)</sup> (旧形式)	/PAO	S POBELCEV?/PAO	PAO
特許権利人/出願人タイプ (現行形式)	/PAT	S CORP/PAT	PAT
特許国	/PC	S EP/PC	PI
特許情報の公表タイプ	/PIT	S OSDE/PIT	PIT
特許種類コード	/PK	S DEA1/PK	PI
特許種類コード、Max	/PK. M	S EPA1/PK. M	PI
特許番号 <sup>3)</sup>	/PN	S DE1302622/PN	PI
対象特許関連引用文献	/PSR	S W08001016/PSR	PSR
特許タイプ	/PT	S OP3/PT	PI
特許タイプ、Max	/PT. M	S AOTW/PT. M	PI
特許の発行週 <sup>2)</sup>	/PW	S 199901/PW	表示されない
優先権国	/PRC	S AU/PRC	PRAI
優先権日 <sup>2)</sup>	/PRD	S 19830400>PRD	PRAI
優先権種類コード	/PRK	S DEA/PRK	PRAI
優先権番号 <sup>3)</sup>	/PRN	S FR92-15537/PRN S 92FR-0015537/PRN	PRAI
優先権タイプ	/PRT	S WP/PRT	PRAI
優先権年 <sup>2)</sup>	/PRY	S 1990/PRY	PRAI
発行日 <sup>2)</sup>	/PD	S 19980100-19980630/PD	PI
発行日、Max <sup>2)</sup>	/PD. M	S 19990128/PD. M	PI
発行年 <sup>2)</sup>	/PY	S 1999/PY	PI
発行年、Max <sup>2)</sup>	/PY. M	S 1999/PY. M	PI
特許以外の引用文献	/REN	S KRAFTWERKSTECHNIK/REN	REN
引用特許国	/RPC	S DE/RPC	REP
引用特許種類コード	/RPK	S DEA/RPK	REP
引用特許番号 <sup>3)</sup>	/RPN	S DE2750426/RPN	REP
引用特許タイプ	/RPT	S SRN/RPT	REP

(続く)

- 1) 前方一致、後方一致および中間任意検索がこのフィールドで利用可能です。利用の際には、語幹の長さは4文字以上が必要です。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) STN形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。
- 4) このフィールドでは、(S)演算子はスペースで代用できます。

## SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
関連特許国	/RLC	S DE/RLC	RLI
関連出願日 <sup>2)</sup>	/RLD	S 19810102/RLD	RLI
関連出願種類コード	/RLK	S DEA3/RLK	RLI
関連出願番号 <sup>3)</sup>	/RLN	S DE81-3120021/RLN	RLI
関連出願タイプ	/RLT	S DIV/RLT	RLI
関連出願年 <sup>2)</sup>	/RLY	S RLY>1997	RLI
フィールドの存在	/FA	S SPC/FA	SPC
系統番号 (AKZまたは一連番号)	/SN	S DE3152498. 2/SN	SN
発明の標題	/TI	S ACHSENSTEUERUNG/TI	TI
更新日 <sup>2)</sup>	/UP	S L1 AND UP>=19981200	UPNT, UPPK, UPPI
抄録の更新日 <sup>2)</sup>	/UPAB	S DEC 1998/UPAB	UPAB
対応特許の更新日 <sup>2)</sup>	/UPFI	S 10 DEC 1998/UPFI	UPFI
法的状況の更新日 <sup>2)</sup>	/UPNT	S 19981203/UPNT	UPNT
特許情報の更新日 <sup>2)</sup>	/UPPI	S 19981203/UPPI	UPPI
特許種類の更新日 <sup>2)</sup>	/UPPK	S UPPK>NOV 1998	UPPK
SDIの更新日 <sup>2)</sup>	/UPS	S UPS=19981210	UPS

1) 前方一致、後方一致および中間任意検索がこのフィールドで利用可能です。利用の際には、語幹の長さは4文字以上が必要です。

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) STN形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

4) このフィールドでは、(S)演算子はスペースで代用できます。

## スーパーサーチフィールド

必要な情報を含む1つまたはそれ以上のフィールドの検索を実行する場合には、スーパーサーチコードを入力します。スーパーサーチフィールドはクロスオーバー検索およびマルチファイル検索を容易にします。スーパーサーチフィールドでEXPANDは利用できません。EXPANDはそれぞれのフィールドコードを指定して利用してください。

フィールド	スーパーサーチ コード	検索された フィールド	SEARCH 例	DISPLAY コード
出願情報 <sup>1)</sup>	/AI	/AC, /AK, /AP, /AT	S DE84-3400052/AI	AI
出願番号グループ <sup>1)</sup>	/APPS	/AP, /FN, /PRN, /RLN	S DE96-19601116/APPS	AI, FIP, PRAI, RLI
国際特許分類グループ	/IPC	/ICA, /ICI, /ICM, /ICS	S C09K/IPC S A01B001/IPC	ICA, ICI, ICM, ICS
特許国グループ	/PCS	/DS, /PC	S L1 AND DE/PCS	DS, PI
特許情報 <sup>1)</sup>	/PI	/PC, /PK, /PN, /PT	S DE1019817/PI	PI
特許番号グループ <sup>1)</sup>	/PATS	/FN, /PN, /RLN, /RPN	S EP100323/PATS	FIP, PI, REP, RLI
優先権出願情報 <sup>1)</sup>	/PRAI	/PRC, /PRK, /PRN, /PRT	S AR98-101437/PRAI	PRAI

1) STN形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

## DISPLAYおよびPRINT形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TI IN”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

GI、GI.H、GIS、NCL、PIT、SQ、SPC、UP、UPAB、UPFI、UPPK、UPPI、UPSを除くすべてのフィールドでハイライト機能が使えます。ハイライト機能をご利用にならない場合にはSET HIGHLIGHT OFFと入力してください。システムのデフォルトはONになっています。HIT、KWIC、OCC形式を使うためには、検索時にハイライト機能がONになっている必要があります。

形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract	抄録	D TI AB 1-5
AG	Agent	代理人	D AG
AGN	Agent Number	代理人番号	D AGN
AI <sup>1)</sup>	Application Information	出願情報	D AI
AN	Accession Number	レコード番号	D L3 AN
CC <sup>2)</sup>	Classification Code	分類コード	D CC
DED <sup>2)</sup>	Data Entry Date	データ入力日	D DED
DEW <sup>2), 3)</sup>	Data Entry Week	データ入力週	D DEW
DS	Designated States (includes PI)	指定国 (PIを含む)	D DS
DT <sup>2)</sup>	Document Type	資料種類	D DT LA
DUP <sup>2)</sup>	Data Update Date	データ更新日	D DUP
ED <sup>2)</sup>	Entry Date	入力日	D ED
EDAB <sup>2), 3)</sup>	Entry Date Abstract or Main Claim	抄録または主クレームの入力日	D EDAB
EXF <sup>2)</sup>	Examiner Field	審査官調査フィールド	D EXF
FA <sup>2)</sup>	Field Availability	フィールドの存在	D FA
FI <sup>1)</sup>	Family Information (FIA, FIP)	対応特許情報 (FIA, FIP)	D FI
FIA <sup>1)</sup>	Family Application Information	対応特許出願情報	D FIA
FIP <sup>1)</sup>	Family Publication Information	対応特許情報	D FIP
GI <sup>4)</sup>	Graphic Information	図形情報	D GI
GI.H <sup>4)</sup>	Graphic Information, High Resolution	図形情報、高解像度	D GI.H
GIS <sup>2)</sup>	Graphic Information Size	図形情報サイズ	D GIS
IC <sup>2)</sup>	IPC, Main and Secondary (ICM, ICS)	国際特許分類、主分類および副分類 (ICM, ICS)	D IC
ICA <sup>2)</sup>	IPC, Additional (Supplementary)	IPC、追加分類 (参考情報)	D ICA
ICI <sup>2)</sup>	IPC, Index (Complementary)	IPC、索引分類 (相補情報)	D ICI
ICM <sup>2)</sup>	IPC, Main (current (IPC6) with concordance to previous editions)	IPC、主分類 (現行IPC第6版の主分類、以前の版に対する対応あり)	D ICM
ICMO <sup>2)</sup>	IPC, Main Old	IPC、主分類、旧版	D ICMO
ICS <sup>2)</sup>	IPC, Secondary (current)	IPC、副分類 (現行)	D ICS
ICSO <sup>2)</sup>	IPC, Secondary Old (with concordance)	IPC、副分類 (旧版) (対応あり)	D ICSO
IN	Inventor, current and old (includes INO)	発明者、現行および旧形式 (INOを含む)	D IN
INC <sup>3)</sup>	Inventor Current	発明者 (現行形式)	D INC
INO	Inventor Old	発明者 (旧形式)	D INO

(続く)

- 1) 特許番号、出願番号、優先権出願番号はSTN形式とダウエント形式の両方で表示できます。STN形式がシステムのデフォルトです。ダウエント形式に変更する時は矢印プロンプト(=>)のところでSET PATENT DERWENTと入力します。STN形式に戻すにはSET PATENT STNと入力します。
- 2) この表示形式のオンライン・ディスプレイ料金は無料です。
- 3) カスタム形式のみ表示できます。
- 4) 図形情報 (画像)、すなわち図面や化学構造式は、オフラインプリント (解像度300dpi) およびDISPLAYで利用できます。DISPLAYを選択すると、画像はバイナリのグラフィックデータとして転送されます。画像を表示するには、STN ExpressのようなCCITTのT6グループ4の圧縮法を用いたTIEF画像を処理できる通信ソフトが必要です。ダウンロード画像の解像度は、GI、ALLG、ALLGU、BRIEFGを用いた次のように調節します。画像サイズ9,999バイトまでは解像度300dpi、9,999バイト以上は解像度150dpi。GI.H、ALLG.H、BRIEFG.Hを用いる場合には解像度は常に300dpiです。

## DISPLAY および PRINT 形式

形式	英語名	内容	入力例
LA <sup>2)</sup>	Language	言語	D LA
MCLM	Main Claim	主クレーム	D MCLM
NCL <sup>2)</sup>	National Patent Classification	自国 (ドイツ) 特許分類	D NCL
NTE	Note	法的状況	D NTE
NTL	Last Note	最新の法的状況	D NTL
OP	Opposition	異議申立人	D OP
OS	Other Source	その他の収録源	D OS
PA (CS)	Patent Assignee, current and old (includes PAO and PAA)	特許権利人/出願人、現行および 旧形式 (PAOとPAAを含む)	D PA
PAA <sup>3)</sup>	Patent Assignee Address	特許権利人/出願人住所	D PAA
PAC <sup>3)</sup>	Patent Assignee Current (includes PAA)	特許権利人/出願人、現行形式 (PAAを含む)	D PAC
PAN	Patent Assignee Number	特許権利人/出願人番号	D PAN
PAO	Patent Assignee Old	特許権利人/出願人、旧形式	D PAO
PAT	Patent Assignee Type	特許権利人/出願人タイプ	D PAT
PI <sup>1)</sup>	Patent Information	特許情報	D PI
PI. M <sup>1)</sup>	Patent Information (Max)	特許情報 (Max)	D PI. M
PIT <sup>2)</sup>	Patent Information Publication Type	特許情報のタイプ	D PIT
PRAI	Priority Information	優先権情報	D PRAI
PSR	Patent Sequence Reference	対象特許関連引用文献	D PSR
PST <sup>2)</sup>	Passat Term	Passatターム	D PST
RE <sup>1)</sup>	Reference Patent and Non-Patent Literature (REP, REN)	特許および特許以外の引用文献 (REP, REN)	D RE
REN	Referenced Non-Patent Literature	特許以外の引用文献	D REN
REP <sup>1)</sup>	Referenced Patent Literature	引用特許文献	D REP
RLI <sup>1)</sup>	Related Application Information	関連出願情報	D RLI
SN	System Number (AKZ or Serial No.)	系統番号 (AKZまたは一連番号)	D SN
SO	Source	収録源	D SO
SPC	Supplementary Protection Certificate	追加保護証明書	D SPC
TI <sup>2)</sup>	Title	発明の標題	D TI
TI. M <sup>2)</sup>	Titles (TI, TIEN)	標題グループ (TI, TIEN)	D TI. M
TIEN	Title in English	英語の標題	D TIEN
UP <sup>2)</sup>	Update Date (DUP, UPPK, UPS)	更新日 (DUP, UPPK, UPS)	D UP
UPAB <sup>2), 3)</sup>	Update Abstract	抄録の更新日	D UPAB
UPFI <sup>2), 3)</sup>	Update Family Information	対応特許の更新日	D UPFI
UPNT <sup>2), 3)</sup>	Update Note Information	法的状況の更新日	D UPNT
UPPI <sup>2), 3)</sup>	Update Patent Information	特許情報の更新日	D UPPI
UPPK <sup>2), 3)</sup>	Update Patent Kind	特許種類の更新日	D UPPK
UPS <sup>2), 3)</sup>	Update Date SDI	SDIの更新日	D UPS
ABS	DED, DUP, AB, MCLM		D ABS
ALL <sup>1)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, NTE, NTL, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC, AB, MCLM, FA, SPC, OP		D ALL

(続く)

- 1) 特許番号、出願番号、優先権出願番号はSTN形式とダウエント形式の両方で表示できます。STN形式がシステムのデフォルトです。ダウエント形式に変更する時は矢印プロンプト (=⇒)のところで SET PATENT DERWENT と入力します。STN形式に戻すには SET PATENT STNと入力します。
- 2) この表示形式のオンライン・ディスプレイ料金は無料です。
- 3) カスタム形式のみ表示できます。
- 4) 図形情報 (画像)、すなわち図面や化学構造式は、オフラインプリント (解像度300dpi) およびDISPLAYで利用できます。DISPLAYを選択すると、画像はバイナリのグラフィックデータとして転送されます。画像を表示するには、STN ExpressのようなCCITTのT6グループ4の圧縮法を用いたTIEF画像を処理できる通信ソフトが必要です。ダウンロード画像の解像度は、GI, ALLG, ALLGU, BRIEFGを用い次のように調節します。画像サイズ9,999バイトまでは解像度300dpi、9,999バイト以上は解像度150dpi。GI.H, ALLG.H, BRIEFG.Hを用いる場合には解像度は常に300dpiです。

## DISPLAYおよびPRINT形式

形式	内容	入力例
ALLG <sup>1), 4)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, NTE, NTL, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC, GI, AB, MCLM, FA, OP	D ALLG
ALLG.H <sup>1), 4)</sup>	ALLGと同じ、ただしGIの代りにGI.Hが入る	D ALLG.H
BIB <sup>1)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS	D BIB
BRIEF <sup>1)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC, AB, MCLM, FA	D BRIEF
BRIEFG <sup>1), 4)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC, GI, AB, MCLM, FA	D BRIEFG
BRIEFG.H <sup>1), 4)</sup>	BRIEFGと同じ、ただしGIの代りにGI.Hが入る	D BRIEFG.H
IALL (ALLU) <sup>1)</sup>	フィールド名付きインデント型ALL形式	D IALL
IALLG (ALLGU) <sup>1)</sup>	フィールド名付きインデント型ALLG形式	D IALLG
IBIB (BIBU) <sup>1)</sup>	フィールド名付きインデント型BIB形式	D IBIB
IND <sup>2)</sup>	IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC	D IND
IPC <sup>2)</sup>	国際特許分類 (IC, ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI)	D IPC
ISTD (STDU)	フィールド名付きインデント型STD形式	D ISTD
MAX <sup>1)</sup>	AN, DED, DUP, SN, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, NTE, NTL, PIT, PI, M, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC, GIS, AB, MCLM, PST, FA, SPC, OP, ED, UP	D MAX
MAXG <sup>1), 4)</sup>	AN, DED, DUP, SN, PSR, TI, TIEN, IN, INO, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, NTE, NTL, PIT, PI, M, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC, ICA, ICI, NCL, CC, GIS, GI.H, AB, MCLM, PST, FA, SPC, OP, ED, UP	D MAXG
STD <sup>1)</sup>	AN, DED, DUP, PSR, TI, TIEN, IN, PA, PAO, PAN, PAT, AG, AGN, EXF, SO, DT, LA, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, FI (FIA, FIP), RE (REP, REN), OS, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO, ICA, ICI), NCL, CC (デフォルトはSTD)	D 2 L7
SCAN <sup>2), 5)</sup>	TI (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
TRIAL <sup>2)</sup> (TRI, SAM)	TI, IC (ICM, ICMO, ICS, ICSO), ICA, ICI, NCL, CC	D TRIAL TOTAL
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後20語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC NOH
OCC <sup>2)</sup>	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC 1-6

1) 特許番号、出願番号、優先権出願番号はSTN形式とダウエント形式の両方で表示できます。STN形式がシステムのデフォルトです。ダウエント形式に変更する時は矢印プロンプト(=>)のところで SET PATENT DERWENT と入力します。STN形式に戻すには SET PATENT STNと入力します。

2) この表示形式のオンライン・ディスプレイ料金は無料です。

3) カスタム形式のみ表示できます。

4) 図形情報(画像)、すなわち図面や化学構造式は、オフラインプリント(解像度300dpi)およびDISPLAYで利用できます。DISPLAYを選択すると、画像はバイナリのグラフィックデータとして転送されます。画像を表示するには、STN ExpressのようなCCITTのT6グループ4の圧縮法を用いたTIEF画像を処理できる通信ソフトが必要です。ダウンロード画像の解像度は、GI, ALLG, ALLGU, BRIEFGを用い次のように調節します。画像サイズ9,999バイトまでは解像度300dpi、9,999バイト以上は解像度150dpi。GI.H, ALLG.H, BRIEFG.Hを用いる場合には解像度は常に300dpiです。

5) SCANは、コマンドに続けて入力する必要があります。例: D SCAN または DISPLAY SCAN

## SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

SELECTコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。

ANALYZEコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にL番号を付与します。

(該当項目はY、該当しないものはNで表示されています。)

SORTコマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
抄録	AB	Y <sup>2)</sup>	N
レコード番号	AN	Y	N
代理人	AG	Y	Y
代理人番号	AGN	Y	Y
出願国	AC	Y	Y
出願日	AD	Y	Y
出願情報 <sup>3)</sup>	AI	Y <sup>4)</sup>	Y
出願種類コード	AK	Y	Y
出願番号 <sup>3)</sup>	AP	Y	Y
出願番号グループ	APPS	Y <sup>5)</sup>	N
出願タイプ	AT	Y	Y
出願年	AY	Y	Y
分類コード	CC	Y	Y
データ入力日	DED	Y	Y
データ入力週	DEW	Y	Y
指定国	DS	Y	Y
資料種類	DT	Y	Y
入力日	ED	Y	Y
抄録または主クレームの入力日	EDAB	Y <sup>6)</sup>	N
入力週	EW	Y	Y
審査官調査フィールド	EXF	Y <sup>6)</sup>	Y
対応特許情報 <sup>3)</sup>	FI	Y <sup>7)</sup>	N
対応特許出願国	FAC	Y	N
対応特許出願日	FAD	Y	N
対応特許出願情報 <sup>3)</sup>	FIA	Y <sup>8)</sup>	N
対応特許種類コード	FAK	Y	N
対応特許出願番号	FAP	Y	N
対応特許出願および特許番号	FN	Y	N
対応特許出願タイプ	FAT	Y	N
対応特許出願年	FAY	Y	N
対応特許国	FC	Y	N
対応特許日	FD	Y	N
対応特許種類コード	FK	Y	N
対応特許公表年	FY	Y	N
対応特許タイプ	FPT	Y	N
対応特許情報 <sup>3)</sup>	FIP	Y <sup>9)</sup>	N
フィールドの存在	FA	Y	N
画像情報サイズ	GIS	Y	N
国際特許分類 (IPC)	IPC	Y <sup>10)</sup>	Y

(続く)

- 1) ヒットタームだけを抽出させるには、HITを使います。例: SEL HIT CT
- 2) SELECTされた用語に/BIが付きます。
- 3) 出願、優先権および特許番号はSET PATENTコマンドを用い、形式をダウエントまたはSTNで指定します。
- 4) 出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APが付きます。
- 5) 出願番号および優先権番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APPSが付きます。
- 6) SELECT HIT およびANALYZE HITはこのフィールドでは使えません。
- 7) 対応特許出願番号および対応特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FNが付きます。
- 8) 対応特許出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIAが付きます。
- 9) 対応特許特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIPが付きます。
- 10) ICA, ICI, ICM, ICMQ, ICS, ICSOがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/IPCが付きます。

## SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
発明者、現行形式および旧形式	IN	Y	Y
発明者住所	INA	Y <sup>6)</sup>	Y
発明者、現行形式	INC	Y	Y
発明者、旧形式	INO	Y	Y
IPC、追加分類 (参考情報)	ICA	Y	Y
IPC、索引分類 (相補情報)	ICI	Y	Y
IPC、主分類	ICM	Y	Y
IPC、主分類、旧版	ICMO	Y	Y
IPC、主分類および副分類	IC	Y	Y
IPC、副分類	ICS	Y	Y
IPC、副分類、旧版	ICSO	Y	Y
言語	LA	Y	Y
最新の法的状況	NTL	Y	Y
主クレーム	MCLM	Y <sup>11)</sup>	Y
自国 (ドイツ) 特許分類	NCL	Y <sup>6)</sup>	Y
法的状況	NTE	Y	N
異議申立人	OP	Y	Y
その他の収録源	OS	Y	Y
Passatターム	PST	Y	N
特許権利人/出願人、現行および旧形式	PA	Y	Y
	CS	Y <sup>12)</sup>	Y
特許権利人/出願人住所	PAA	Y	N
特許権利人/出願人、現行形式	PAC	Y	Y
特許権利人/出願人番号	PAN	Y	Y
特許権利人/出願人、旧形式	PAO	Y	Y
特許権利人/出願人タイプ	PAT	Y	Y
特許国グループ	PCS	Y <sup>13)</sup>	N
特許国	PC	Y	Y
特許情報 <sup>3)</sup>	PI	Y <sup>14)</sup>	Y
特許情報、Max	PI. M	Y <sup>15)</sup>	Y
特許情報のタイプ	PIT	Y <sup>6)</sup>	Y
特許種類コード	PK	Y	Y
特許番号 <sup>3)</sup>	PN	Y	Y
	PATS	Y	Y
特許発行日	PD	Y	Y
対象特許関連引用文献	PSR	Y	N
特許タイプ	PT	Y	Y
優先権国	PRC	Y	Y
優先権日	PRD	Y	Y

(続く)

- 1) ヒットタームだけを抽出させるには、HITを使います。例: SEL HIT CT
- 2) SELECTされた用語に/BIが付きます。
- 3) 出願、優先権および特許番号はSET PATENTコマンドを用い、形式をダウエントまたはSTNで指定します。
- 4) 出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APが付きます。
- 5) 出願番号および優先権番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APPSが付きます。
- 6) SELECT HIT およびANALYZE HITはこのフィールドでは使えません。
- 7) 対応特許出願番号および対応特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FNが付きます。
- 8) 対応特許出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIAが付きます。
- 9) 対応特許特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIPが付きます。
- 10) ICA, ICI, ICM, ICMO, ICS, ICSOがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/IPCが付きます。
- 11) SELECTされた用語に/BIが付きます。
- 12) 現行および旧形式の特許権利人/出願人がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PAが付きます。
- 13) 特許国と指定国からの国コードがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PCSが付きます。
- 14) 特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PNが付きます。
- 15) 特許番号MaxがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PNが付きます。

## SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
優先権情報 <sup>3)</sup>	PRAI	Y <sup>16)</sup>	Y
優先権種類コード	PRK	Y	Y
優先権番号 <sup>3)</sup>	PRN	Y	Y
優先権タイプ	PRT	Y	Y
発行年	PY	Y	Y
特許以外の引用文献	REN	Y	N
引用特許国	RPC	Y	N
引用特許種類	RPK	Y	N
引用特許番号 <sup>3)</sup>	RPN	Y	N
引用特許タイプ	RPT	Y	N
引用特許文献 <sup>3)</sup>	REP	Y	N
関連出願国	RLC	Y	N
関連出願日	RLD	Y	N
関連出願情報 <sup>3)</sup>	RLI	Y <sup>17)</sup>	N
関連出願種類コード	RLK	Y	N
関連出願番号 <sup>3)</sup>	RLN	Y	N
関連出願タイプ	RLT	Y	N
収録源	SO	Y <sup>6)</sup>	Y
IPCのサブクラスまで	SCL	Y	N
IPC追加分類 (参考情報) のサブクラスまで	SCLA	Y	N
IPC主分類のサブクラスまで	SCLM	Y	N
IPC副分類のサブクラスまで	SCLS	Y	N
IPCのサブクラス、メイングループまで	SCG	Y	N
IPC追加分類 (参考情報) のサブクラス、 メイングループまで	SCGA	Y	N
IPC主分類のサブクラス、メイングループまで	SCGM	Y	N
IPC副分類のサブクラス、メイングループまで	SCGS	Y	N
追加保護証明書	SPC	Y <sup>6)</sup>	N
系統番号	SN	Y	Y
発明の標題	TI	Y (デフォルト)	Y
英語の発明の標題	TIEN	Y	Y
発明の標題、Max	TI. M	Y	Y
記事内容コード	TC	Y <sup>18)</sup>	Y
抄録の更新日	UPAB	Y <sup>6)</sup>	N
更新日	UP	Y <sup>6)</sup>	N
対応特許の更新日	UPFI	Y <sup>6)</sup>	N
法的状況の更新日	UPNT	Y	N
特許情報の更新日	UPPI	Y <sup>6)</sup>	N
特許種類の更新日	UPPK	Y <sup>6)</sup>	N
SDIの更新日	UPS	Y <sup>6)</sup>	N

- 1) ヒットタームだけを抽出させるには、HITを使います。例: SEL HIT CT
- 2) SELECTされた用語に/BIが付きます。
- 3) 出願、優先権および特許番号はSET PATENTコマンドを用い、形式をダウエントまたはSTNで指定します。
- 4) 出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APが付きます。
- 5) 出願番号および優先権番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/APPSが付きます。
- 6) SELECT HITおよびANALYZE HITはこのフィールドでは使えません。
- 7) 対応特許出願番号および対応特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FNが付きます。
- 8) 対応特許出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIAが付きます。
- 9) 対応特許特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/FIPが付きます。
- 10) ICA, ICI, ICM, ICS, ICSOがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/IPCが付きます。
- 11) SELECTされた用語に/BIが付きます。
- 12) 現行および旧形式の特許権利人/出願人がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PAが付きます。
- 13) 特許国と指定国からの国コードがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PCSが付きます。
- 14) 特許番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PNが付きます。
- 15) 特許番号MaxがSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PNが付きます。
- 16) 優先権番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/PRAIが付きます。
- 17) 関連出願番号がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/RLIが付きます。
- 18) 資料種類がSELECTまたはANALYZEされ、SELECTされた用語に/DTが付きます。

## サンプルレコード

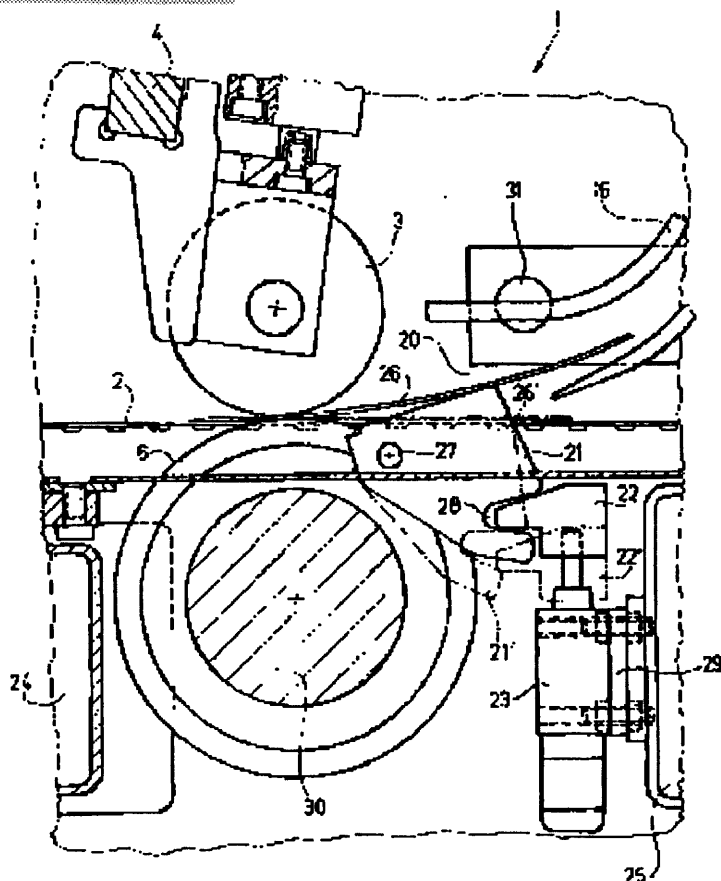
## BIB形式での表示

AN DE19719753 PATDPA DED 19981112 DUP 19981112  
 TI (A1) Verschlussbuegel fuer Abwaesserkanaele zur Sicherung bei der  
 Druckprobe nach DIN 40 33  
 IN Rauschmaier, Georg 'Dipl. Ing. FH' (\*DE 74193 Schwaigern)  
 PA Rauschmaier, Georg 'Dipl. Ing. FH' (\*DE 74193 Schwaigern)  
 PAN 8876932 DE  
 PAT (IND) Natuerliche Person  
 EXF 25 Bauwesen  
 SO DE-Patentblatt 118 (1998) Heft 46, DE A1 Offenl.-Schrift, 1. Veroeff.  
 Textseiten 1; Blattzahl 1; Filmlochkarten 1  
 DT Patent  
 PIT OS DE Offenlegungsschrift, 1. Veroeff.  
 PI DE 19719753 A1 19981112 AO (10) 1. Publ. / DE-Schrift  
 AI DE 97-19719753A 19970510 ADP (22) DE-Patentanmeldung  
 PRAI DE 97-19719753A 19970510 IA (32) Nation. Erstanmeldung  
 FI  
 FIA DE 97-19719753A 19970510 ADP (22) DE19719753  
 FIP DE 19719753 A1 19981112 AO (43) DE-Offenlegung

## BRIEFG. H形式での表示

AN DE4316413 PATDPA DED 19941124 DUP 19981015  
 TI (A1) Einrichtung zur Entnahme von Probeexemplaren an  
 Rotationsquerschneidern  
 IN Mack, Richard Burkhard (\*DE 6835 Bruehl)  
 Klenk, Rainer (\*DE 6837 St Leon-Rot)  
 McKrell, Thomas (\*US Rye, M. H.)  
 PA Heidelberger Druckmaschinen AG (\*DE 69115 Heidelberg)  
 PAN 1004093 DE  
 PAT (CORP) Juristische Person  
 EXF 27 Papier, Druck, Verpackung  
 SO DE-Patentblatt 114 (1994) Heft 47, DE A1 Offenl.-Schrift, 1. Veroeff.  
 Textseiten 11; Blattzahl 8; Zeichnungsseiten 4; Filmlochkarten 2  
 DT Patent  
 LA Deutsch  
 PIT OS DE Offenlegungsschrift, 1. Veroeff.  
 PI DE 4316413 A1 19941124 AO (10) 1. Publ. / DE-Schrift  
 AI DE 93-4316413 A 19930517 ADP (22) DE-Patentanmeldung  
 PRAI DE 93-4316413 A 19930517 IA (32) Nation. Erstanmeldung  
 FI  
 FIA DE 93-4316413 A 19930517 ADP (22) DE4316413  
 FIP DE 4316413 A1 19941124 AO (43) DE-Offenlegung  
 RE  
 REP DE 3010793 C2 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 724901 C SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 2848010 B1 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 2229414 B2 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 1113358 B SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 3527710 A1 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 2609136 A1 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 2330614 A1 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 1786264 A SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DE 1561722 A SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 DD 2141111 A SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 US 4506882 A SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 US 2815949 A SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 IC  
 ICM B65H029-66 (511) IPC-Hauptklasse  
 ICS B65H029-68 (512) IPC-Nebenklasse  
 B65H029-58 (512) IPC-Nebenklasse  
 B65H035-08 (512) IPC-Nebenklasse  
 B41F013-60 (512) IPC-Nebenklasse

## BRIEFG. H形式での表示 (続き)



AB (A1) Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur Entnahme von Probeexemplaren an Rotationsquerschnidern und Auslegern, die kontinuierlich zugeführte Materialbahnen in einer Schneidstation in einzelne Exemplare trennen. Anschliessend werden diese, annähernd beruehrungslos und sich teilweise ueberlappend, in einer Exemplartransportebene gefoerdert. Die Exemplare sind einer der Schneidstation nachgeordneten Verzoegerungsstation zuleitbar. Die Erfindung wird dadurch charakterisiert, dass mindestens ein einer Exemplartransportebene (2) zugeordneter, die Exemplartransportebene (2) bei Aktivierung durchsetzender Schwenknocken (21) die Foerderrichtung von Exemplaren (26) aendert.

FA AB; ICS; INC; PST; REP

## MAX形式での表示

AN DE3718926 PATDPA DED 19981008 DUP 19981015

SN DE3718926.3

TI (C2) Macrolid-Verbindungen, Verfahren zu deren Herstellung und diese Verbindungen enthaltende Mittel

(A1) Macrolid-Verbindungen, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Mittel

IN Sutherland, Derek R. (\*GB St. Giles, Buckinghamshire)

Pereira, Oswy Z. (\*GB Hounslow, Middlesex)

Noble, Hazel M. (\*GB Slough, Buckinghamshire)

Ramsay, Michael V. J. (\*GB South Harrow, Middlesex)

Ward, John B. (\*GB Bushey, Hertfordshire)

Fletton, Richard A. (\*GB Ruislip, Middlesex)

Tiley, Edward P. (\*GB Pinner, Middlesex)

Porter, Neil (\*GB Pinner, Middlesex)

Noble, David (\*GB Slough, Buckinghamshire)

PA American Cyanamid Co. (\*US Madison, N. J.)

PAO (A1) Glaxo Group Ltd. (\*GB London)

(A1) American Cyanamid Co. (\*US Wayne, N. J.)

## MAX形式での表示 (続き)

PAN 8088543 US  
 PAT (CORP) Juristische Person  
 AG Kinzebach und Kollegen, 81679 Muenchen  
 EXF 44 Organische Chemie VI und VII, Kunstharzherstellung  
 SO DE-Patentblatt 107 (1987) Heft 50, DE A1 Offenl.-Schrift, 1. Veroeff.  
 Textseiten 60; Blattzahl 31; Filmlochkarten 8  
 DE-Patentblatt 118 (1998) Heft 03, DE C2 Patentschrift, 2. Veroeff.  
 DT Patent  
 LA Deutsch  
 NTE 19860606: FPRD (32) Erstes Prioritaetsdatum  
 19870605: ADP (22) Anmeldetag d. DE-Patentanm.  
 19870605: BDIV (62) Stammanm., Teil in: 3745133  
 19870605: FRLD (60) Anmeldetag d. ersten Bezugs-Anm.  
 19871210: AO (43) Offenlegungstag der DE-Anmeldung (OS)  
 19980115: PG (45) Veroeff.-Tag der DE-Patenterteilung  
 19980115: SRP (56) Veroeff. d. Entgegenhaltungen auf DE-PS  
 19981023: SRP (56) Veroeff. d. Entgegenhaltungen auf DE-PS  
 NTL 19981023: SRP (56) Veroeff. d. Entgegenhaltungen auf DE-PS  
 PIT PS EF DE-Patentschrift, 2. Veroeff., Einspr.-Frist 3 Mon.  
 PI DE 3718926 C2 19980115 PG OP3 (10) letzte Publ. / DE-Schrift  
 AI DE 87-3718926 A 19870605 ADP (22) DE-Patentanmeldung  
 RLI DE 87-3718926 A3 19870605 BDIV (62) Stammanmeldung  
 DE 87-3745133 A 19870605 DIV (62) Teilungsanmeldung  
 PRAI GB 86-13790 A 19860606 CP (32) Unionsprioritaet  
 GB 86-25854 A 19861029 CP (32) Unionsprioritaet  
 GB 87-8423 A 19870408 CP (32) Unionsprioritaet  
 FI  
 FIA DE 87-3718926 A 19870605 ADP (22) DE3718926  
 FIP DE 3718926 A1 19871210 AO (43) DE-Offenlegung  
 DE 3718926 C2 19980115 PG (45) DE-Patenterteilung  
 RE  
 REP DE 3532794 A1 SRP (56) Aus nation. Pruefungsverf.  
 REN (SRP) JP-Z: J. Antibiotics, XXXVI/8 (1983), S. 980-990  
 OS CA 108:186442 'CA108(21):186442X'  
 CA 111:173914 'CA111(19):173914Q'  
 IC  
 ICM C07D493-22 (511) IPC-Hauptklasse  
 ICS A61K031-35 (512) IPC-Nebenklasse  
 A01N043-90 (512) IPC-Nebenklasse  
 GIS 3844  
 AB (C2) Die Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel I 1 worin  
 R>1 eine Methyl-, Ethyl- oder Isopropylgruppe bedeutet, R>2 ein  
 Wasserstoffatom, eine C<1-C<8-Alkylgruppe oder eine C<3-C<8-Alkenylgruppe  
 bedeutet, wobei die Gruppe =NOR>2 in E-Konfiguration vorliegt, und OR>3  
 eine Hydroxygruppe oder eine substituierte Hydroxygruppe mit bis zu 25  
 Kohlenstoffatomen bedeutet, sowie die Salze davon. Die  
 erfindungsgemaessen Verbindungen koennen zur Bekaeempfung von Insekten,  
 Acarina, Nematoden und anderen Schaedlingen eingesetzt werden.  
 MCLM (C2) 1. Macrolid-Verbindungen der allgemeinen Formel I, worin R1 eine  
 Methyl-, Ethyl- oder Isopropylgruppe bedeutet, R2 ein Wasserstoffatom,  
 eine C1- bis C8-Alkylgruppe oder eine C3- bis C8-Alkenylgruppe bedeutet,  
 wobei die Gruppe =NOR2 in E-Konfiguration vorliegt, und OR3 fuer OH, OR4,  
 OCOR4, OCOOR4 oder OCONR8R9 steht, wobei R4 fuer eine C1- bis  
 C8-Alkylgruppe steht und R8 und R9 unabhaengig voneinander ein  
 Wasserstoffatom oder eine C1- bis C4-Alkylgruppe bedeuten.  
 PST ACARINA; ALKENYL; ALKENYLGRUPPE; ALKYLGRUPPE; ATOM; BEDEUTEN;  
 BEKAEEMPfung; BETREFFEN; EINSETZEN; ENTHALTEN; ERFINDUNG;  
 ERFINDUNGSGEMAESS; ETHYL; FORMEL; GRUPPE; HERSTELLUNG; HYDROXYGRUPPE;  
 INSEKT; ISOPROPYL; ISOPROPYLGRUPPE; KOHLE; KOHLENSTOFF; KOHLENSTOFFATOM;  
 KONFIGURATION; MACROLID; METHYL; MITTEL; MITTELN; MITTLUNG; MITTLUNG;  
 NEMATODE; NEMATODEN; OCONR8R9; OCOOR4; SALZ; SALZEN; SCHAE DLING; STOFF;  
 SUBSTITUIEREN; SUBSTITUIERUNG; SUBSTITUTION; UNABHAENGIG; VERBINDUNG;  
 VERFAHREN; VORLIEGEN; WASSER; WASSERSTOFF; WASSERSTOFFATOM  
 FA AB; AG; ICS; INC; MCLM; OS; PAO; PST; REN; REP; RLI; SPC  
 SPC Arzneimittel Zertifikat Anmeldung  
 DE19875029.3 19981008 (DE3718926)  
 American Cyanamid Co., Five Giralda Farms, Madison, N. J. 07940-0874, US

## MAX形式での表示 (続き)

BGA: 31408. 00. 00                    19950301  
 Moxidectin sowie pharmazeutisch und tierarzneilich vertraegliche Salze  
 davon  
 IPC: C07D493-22  
 EG: Frankreich                    673259 5                    19941230  
       673260 3                    19941230  
       673262 6                    19941230  
 Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und  
 Veterinaermedizin  
 UP    19981015

## TRIAL形式での表示

TI    (A1) Katalysator zur Abgasreinigung und Verfahren zu dessen Herstellung  
 IC  
 ICM   UN                                    (511) IPC-Hauptklasse  
 ICMO B01D053-86                    (511) vorherige IPC-HKL  
 ICS   UN                                    (512) IPC-Nebenklasse  
       B01J023-38                    (512) IPC-Nebenklasse  
 ICSO B01D053-94                    (512) vorherige IPC-NKL  
 ICA   B01J023-40                    (513) // IPC-Zusatzinform.  
       B01J023-58                    (513) // IPC-Zusatzinform.  
 ICI   B01D131:00  
       B01D135:00  
 CC    02 Umweltschutz